

# Rotation de TP - Semestre 8 | 2022-2023

ven. 6 janv.

Groupe TP 1 (mercredis) - 20 élèves										
Séance	Séquence 1			Séquence 2						
	mer. 25 janv.	mer. 1 févr.	mer. 8 févr.	mer. 1 mars	mer. 8 mars	mer. 15 mars	mer. 22 mars	mer. 29 mars	mer. 5 avr.	mer. 12 avr.
CR	mer. 1 févr.	mer. 8 févr.	mer. 15 févr.	mer. 8 mars	mer. 15 mars	mer. 22 mars	mer. 29 mars	mer. 5 avr.	mer. 12 avr.	
TP1.1	A1	B1	A2	T	B2	A3	B3	A4	B4	
TP1.2	B2	A1	B1	T	A2	B4	A3	B3	A4	
TP1.3	A2	B2	A1	T	B1	A4	B4	A3	B3	
TP1.4	B1	A2	B2	T	A1	B3	A4	B4	A3	
TP1.5	A3	B3	A4	B4	T	A1	B1	A2	B2	
TP1.6	B4	A3	B3	A4	T	B2	A1	B1	A2	
TP1.7	A4	B4	A3	B3	T	A2	B2	A1	B1	
TP1.8	B3	A4	B4	A3	T	B1	A2	B2	A1	

## Aberrations

Aberrations sur l'axe	<b>A1</b>	S1.10	On-axis aberrations
Aberrations de champ	<b>A2</b>	S1.4	Off-axis aberrations
Zygo	<b>A3</b>	S1.2	Zygo
HASO	<b>A4</b>	S1.8	HASO

ven. 6 janv.

Groupe TP 2 (mardi) - 22 élèves										
Séance	Séquence 1			Séquence 2						
	mar. 24 janv.	mar. 31 janv.	mar. 7 févr.	mar. 28 févr.	mar. 7 mars	mar. 14 mars	mar. 21 mars	mar. 28 mars	mar. 4 avr.	mar. 11 avr.
CR	mar. 31 janv.	mar. 7 févr.	mar. 14 févr.	mar. 7 mars	mar. 14 mars	mar. 21 mars	mar. 28 mars	mar. 4 avr.	mar. 11 avr.	
TP2.1	A1	B1	A2	T	B2	A3	B3	A4	B4	
TP2.2	B2	A1	B1	T	A2	B4	A3	B3	A4	
TP2.3	A2	B2	A1	T	B1	A4	B4	A3	B3	
TP2.4	B1	A2	B2	T	A1	B3	A4	B4	A3	
TP2.5	A3	B3	A4	B4	T	A1	B1	A2	B2	
TP2.6	B4	A3	B3	A4	T	B2	A1	B1	A2	
TP2.7	A4	B4	A3	B3	T	A2	B2	A1	B1	
TP2.8	B3	A4	B4	A3	T	B1	A2	B2	A1	

## Détecteurs et bruits | Detectors and noise.

Bruit dans un système de photodétection	<b>B1</b>	S1.20	Photodetection noise sources
Caractérisation d'un détecteur infrarouge	<b>B2</b>	S1.15	Infrared detector characteristic meas.
Etude d'un capteur CMOS industriel	<b>B3</b>	S1.24	CMOS sensor
Caméra infrarouge	<b>B4</b>	S1.28	Thermal camera

# Rotation de TP - Semestre 8 | 2022-2023 - Semestre 8 | 2022-2023

ven. 6 janv.

Groupe TP 3 (lundi) - 22 élèves

Séquence 1

Séquence 2

Séance	lun. 23 janv.	lun. 30 janv.	lun. 6 févr.		lun. 27 févr.	lun. 6 mars	lun. 13 mars	lun. 20 mars	lun. 27 mars	lun. 3 avr.	lun. 10 avr.
CR	lun. 30 janv.	lun. 6 févr.	lun. 13 févr.		lun. 6 mars	lun. 13 mars	lun. 20 mars	lun. 27 mars	lun. 3 avr.	lun. 10 avr.	
TP3.1	A1	B1	A2		T	B2	A3	B3	A4	B4	
TP3.2	B2	A1	B1		T	A2	B4	A3	B3	A4	
TP3.3	A2	B2	A1		T	B1	A4	B4	A3	B3	
TP3.4	B1	A2	B2		T	A1	B3	A4	B4	A3	
TP3.5	A3	B3	A4		B4	T	A1	B1	A2	B2	
TP3.6	B4	A3	B3		A4	T	B2	A1	B1	A2	
TP3.7	A4	B4	A3		B3	T	A2	B2	A1	B1	
TP3.8	B3	A4	B4		A3	T	B1	A2	B2	A1	

Aberrations

Aberrations sur l'axe	<b>A1</b>	s1.10	On-axis aberrations
Aberrations de champ	<b>A2</b>	s1.4	Off-axis aberrations
Zygo	<b>A3</b>	s1.2	Zygo
HASO	<b>A4</b>	s1.8	HASO

ven. 6 janv.

Groupe TP 4 (jeudi) - 21 élèves

Séquence 1

Séquence 2

Séance	jeu. 26 janv.	jeu. 2 févr.	jeu. 9 févr.		jeu. 2 mars	jeu. 9 mars	jeu. 16 mars	jeu. 23 mars	jeu. 30 mars	jeu. 6 avr.	jeu. 13 avr.
CR	jeu. 2 févr.	jeu. 9 févr.	jeu. 16 févr.		jeu. 9 mars	jeu. 30 mars	jeu. 23 mars	jeu. 30 mars	jeu. 6 avr.	jeu. 13 avr.	
TP4.1	A1	B1	A2		T	B2	A3	B3	A4	B4	
TP4.2	B2	A1	B1		T	A2	B4	A3	B3	A4	
TP4.4	A2	B2	A1		T	B1	A4	B4	A3	B3	
TP4.4	B1	A2	B2		T	A1	B3	A4	B4	A3	
TP4.5	A3	B3	A4		B4	T	A1	B1	A2	B2	
TP4.6	B4	A3	B3		A4	T	B2	A1	B1	A2	
TP4.7	A4	B4	A3		B3	T	A2	B2	A1	B1	
TP4.8	B3	A4	B4		A3	T	B1	A2	B2	A1	

Détecteurs et bruits | Detectors and noise.

Bruit dans un système de photodétection	<b>B1</b>	s1.20	Photodetection noise sources
Caractérisation d'un détecteur infrarouge	<b>B2</b>	s1.15	Infrared detector characteristic meas
Etude d'un capteur CMOS industriel	<b>B3</b>	s1.24	CMOS sensor
Caméra infrarouge	<b>B4</b>	s1.28	Thermal camera

